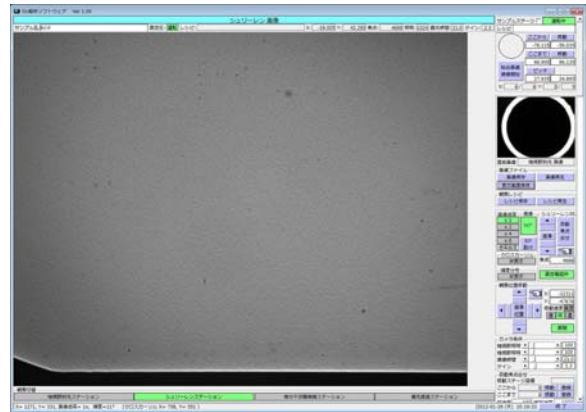
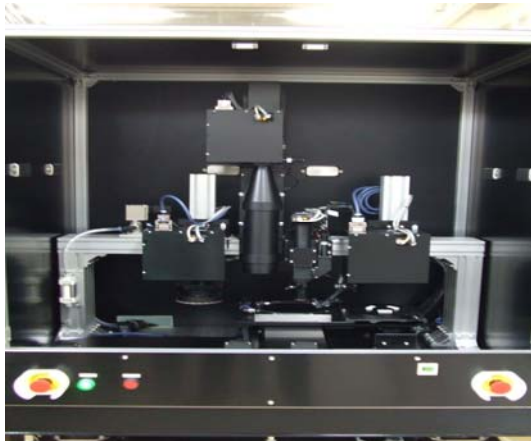


化合物複合検査装置



概要

化合物系ウエハー検査装置です。6インチ迄のSi c、Gan、サファイアウエハーなどの、内部マイクロパイプや、脈離、表面傷、異物、研磨痕などの検査に有効です。検査に、スーパーマクロ、微分干渉、暗視野、透過の4つ光学系を持ち、全ての光学系にオートフォーカスを持ち、自動ステージにより同じ座標系での検査が可能です。オプションで、同じ座標系に、AFMやウエハー厚さ測定を載せる事も可能です。

装置構成例

- (1) スーパーマクロ (SM-75)
 - ・ウエハ局所のシュリーレン画像観察
 - ・局所画像の合成処理によるウエハ全体画像
- (2) 微分干渉顕微画像ステーション
 - ・ウエハ局所の暗視野顕、明視野顕微画像観察
- (3) 暗視野斜光画像ステーション
 - ・局所ウエハ表面の暗視野斜光画像観察
- (4) 偏光透過画像ステーション
 - ・局所ウエハ表面の偏光透過画像観察
- (5) 自動ステージ
 - (1)、(2)、(3)、(4) を一体構造とし、ユニット間のワーク移動&座標連動を行う。



アプリケーション

- ウエハー内部のマイクロパイプ
- ウエハー内部の脈離
- 表面傷検査、研磨痕検査
- 異物検査 (内部含む)
- 表面粗さやパターン傾斜等の測定 (オプションAFM)
- スクラッチ、ピット、泡の検査
- 非接触型、厚さ測定 (オプション厚さ計)
- マイクロクラック、ピンホール
- その他、外観検査全般

設定画面

